

适用于芯片、MELF、引线电容之测包机



- 对应CE安全规范
- 搭载接触检知(CONTACT CHECK)功能
- 测定时间:1.2msec
- 微小电容到大电容广泛范围的测定档位(20pF~200 μ F Range)
- 测定频率:1kHz±0.1% (正弦波形)
- 五端点测量方式
- 搭载微处理器输出 HI/GO/LO
- 3位半(1999)数字显示
- 选配GP-IB或RS-232C(OPTION)
- 搭载打印机输出(搭载Centronics)
- 即使测定中也可输出测定值、 δ 、 3δ 、mas.、min.、日期、时间等数值至打印机

Specifications

测定范围及准确度(周围温度23°C±5°C)※D<0.1 并联等价回路

| 测定档位 | 测定准确度 | 测定电压 |
|---------|-------------------------------|------|
| 20pF | ±0.25% of rdg±2digit±0.01pF以内 | 1V |
| 200pF | | |
| 2nF | | |
| 20nF | | |
| 200nF | | |
| 2 μ F | | |
| 20 μ F | ±0.2% of rdg±2digit以内 | 1V以下 |
| 200 μ F | | |

※100 μ F以下为(±0.8% of rdg±3digit) × 测定值[μ F]/100以内

| | |
|------------|--|
| 测定方式 | 五端点测定方式、并联等价回路 |
| 测定频率 | 1kHz±0.1%、正弦波形 |
| 寄生电容补偿范围 | 约20pF |
| 全核度及零点温度系数 | ±100ppm/°C以内 |
| 测定时间 | [外部启动] 1.2msec. |
| | [Free Running] 5~10次/秒 |
| 比较器设定范围 | HI/LO皆为1999 |
| 使用周围环境 | 温度:+5°C~+40°C、湿度:85%以下 |
| 电源需求 | AC100V~240V切换、50/60Hz、约30VA |
| 外观尺寸 | 约333(W) × 99(H) × 300(D)mm (不包含橡胶垫等凸出物。) |
| 重量 | 约5.8kg |

Option

● GP-IB ● RS-232C

※可选择一种上述选配功能